پروفایلومتر

Profilometer

پروفایلومتر یکی از ابزارهای کلیدی در آزمایشگاه های لایه نازک است. با حرکت سوزن (tip) بر روی سطح و اندازه گیری پستی و بلندی می توان ارتفاع پله را اندازه گرفت و ضخامت لایه را تعیین کرد و یا میزان زبری سطح را مشخص نمود. فناوری به کار رفته در PFM-5020 امکان اندازه گیری Z با دقت ۵۰ نانومتر را فراهم می کند. پروفایلومتر کاربردهای متعددی در صنایع نیم رسانا، سلول های خورشیدی و LED، سنسورها، پوشش ها و MEMS دارد.

قابلیت های دستگاه

- اندازه گیری پروفایل سطح در ۱ بعد با دقت ۵۰ نانومتر
- اندازه گیری زبری سطوح
- اندازه گیری ضخامت لایه ها در محل پله

- دارای دوربین نمای سوزن اندازه گیری
- سیستم Auto-approach

Specifications	
Model	PFM-6020
Measurement technique	Contact stylus profilometry
Measurement capability	1-Dimensional surface profile measurement
Sample viewing	640 x 480 pixel, 50-500X Magnification, Focusable digital camera
Standard stylus radius	1 Micron
Stylus sensor	Capacitive displacement sensor
Sample stage	Moving
Max. wafer size	120 mm
Vibration isolation	Internal vibration isolation system
Scan course	3 cm
Data points per scan	Max. 10,000
Scan steps	≥ 2.5 µm
Step height precision	50 nm
Max. measuring vertical range	200 µm
Vertical resolution	1 nm
Max. sample thickness	Up to 80 mm

شرکت توسعه فناوری شریف سولار

آدرس: تهران، خیابان آزادی، ضلع غربی دانشگاه شریف، کوچه صادقی، پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف (پلاک ۲۹)– واحد ۱۰

تلفن: ۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۹۹ فکس: ۰۲۱-۸۹۷۷۸۲۱۴ ایمیل: info@sharifsolar.ir وبسایت: www.sharifsolar.ir